



Formalismes físics per a la microscòpia d'efecte túnel [aplicació d'un STM atmosfèric en microelectrònica : caracterització de Si i d'estructures MOS /

Barniol i Beumala, Núria

Universidad Autónoma de Barcelona,
1993

Monografía

<https://rebiunoda.pro.baratznet.cloud:38443/OpacDiscovery/public/catalog/detail/b2FpOmNlbGVicmF0aW9uOmVzLmJhcmF0ei5yZW4vMjc5NDY2Ng>

Título: Formalismes físics per a la microscòpia d'efecte túnel [Microforma] :] aplicació d'un STM atmosfèric en microelectrònica caracterització de Si i d'estructures MOS Núria Barniol i Beumala ; [direcció Xavier Aymerich Humet]

Editorial: Bellaterra Universidad Autónoma de Barcelona 1993

Descripción física: 1 microficha (11 x 15) + 1 folleto (7 p. ; 18 cm)

Mención de serie: Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona

Nota general: Resumen en catalán e inglés Tesis Univ. Autónoma de Barcelona

ISBN: 84-7929-395-0

Materia Entidad: Universidad Autónoma de Barcelona (España)- Tesis y disertaciones académicas

Materia: Microscopia electrónica Dispositivos MOS Silicio Microscopios electronicos de barrido

Autores: Aymerich Humet, Xavier, director

- informa@baratz.es